

EPODOC / EPO.

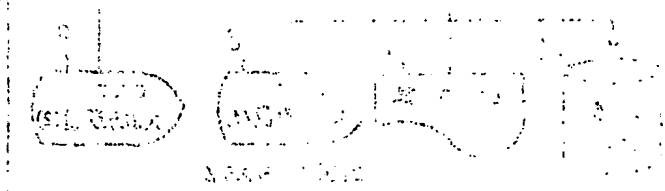
PN - JP55147742 A 19801117
PD - 1980-11-17
PR - JP19790055431 19790507
OPD - 1979-05-07
TI - GENERATING UNIT OF SIMULATION SIGNAL
IN - TSUSHIMO TOYOTAROU
PA - MITSUBISHI ELECTRIC CORP
IC - G06F11/00

PAJ / JPO

PN - JP55147742 A 19801117
PD - 1980-11-17
AP - JP19790055431 19790507
IN - TSUSHIMO TOYOTARO
PA - MITSUBISHI ELECTRIC CORP
TI - GENERATING UNIT OF SIMULATION SIGNAL
AB - PURPOSE: To perform many tests in a short time and to enable repetitive tests as required, by storing the data to produce the simulation signal considering various cases in the memory unit.

- CONSTITUTION: When the indication signal is received, the simulation signal generating unit 2 refers to the time stored in the memory unit 1, and the simulation signal in the unit 1 is produced to the tested unit 4. Further, the unit 4 executes the function corresponded sequentially in response to the production of the generation of the simulation signal, the time and type of the simulation signal fed to the unit 4 is printed and recorded in the printer 6, and the type of the simulation signal fed at each time is displayed for required time interval for the display unit 7. Thus, the data to produce the simulation signal considering various cases is stored in the unit 1, allowing to perform many tests in a short time and execute repetitively the tests are required.

I - G06F11/00



THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁 (JP)
⑫ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭55—147742

① Int. Cl.³
G 06 F 11/00

識別記号

庁内整理番号
7368—5B

⑬ 公開 昭和55年(1980)11月17日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑭ 模擬信号発生装置

株式会社コンピュータシステム
工場内

① 特 願 昭54—55431

① 出 願 人 三菱電機株式会社

② 出 願 昭54(1979)5月7日

東京都千代田区丸の内2丁目2

③ 発 明 者 津下豊太郎

番3号

鎌倉市上町屋325番地三菱電機

④ 代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

模擬信号発生装置

2. 特許請求の範囲

模擬信号の発生時刻および種類を記憶する記憶装置、この記憶装置の記憶内容にしたがつて模擬信号を発生する模擬信号発生装置、この模擬信号発生装置が発生する模擬信号の記録および表示の少なくともいずれかを行う装置を備えたことを特徴とする模擬信号発生装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は例えば工業用計算機システムなどのような、各種データを受けてそれら进行处理し、その処理結果に対応した機能を実施する装置に模擬信号を与えて試験を行う装置に関するものである。

従来、プラントの各点から多くの信号を受けてそれぞれの信号に対応して所定の処理を行う工業

用計算機システムにおいて、システムの機能の試験を行う場合、プラントの各点に設けられた検出装置からの実際の信号を、それぞれ所定の順序に所定の間隔で上記システムに加えて試験を行うことが行われていたため、試験に長時間を要し、特に多くの場合を想定した試験を行うためには多大な時間と煩雑な操作が必要とされる欠点があつた。

この発明は、工業用計算機システム等の試験を短時間のうちに多くの場合を想定して行うことができる模擬信号発生装置を得ることを目的とするものである。

図面はこの発明の一実施例を示すブロック図であつて、図において(1)は被試験装置(4)に入力される複数個の與信号(5)のそれぞれに対応する模擬信号の発生時刻およびそれらの模擬信号の種類を記憶している記憶装置、(2)は記憶装置(1)の記憶内容にしたがつて各模擬信号(3)を被試験装置(4)に対して出力する模擬信号発生装置、(6)は模擬信号発生装置(2)が発生した模擬信号を記録する印字装置、(7)は模擬信号発生装置(2)が発生した模擬信号を設

示するディスプレイ装置である。(8)は模擬信号発生開始を指示する信号である。

次に動作を説明する。指示信号(8)が加えられることによつて模擬信号発生装置(2)に模擬信号発生開始が指示されると、模擬信号発生装置(2)は記憶装置(1)に記憶されている模擬信号発生時刻を参照し、当該時刻になると、今度は記憶装置(1)中の模擬信号の種類を参照して、記憶内容の指示する種類の模擬信号を被試験装置(4)に対して発生する。このようにして模擬信号発生装置(2)は記憶装置(1)を参照しながら、順次該当する模擬信号を自動的に発生してゆく。これらの模擬信号の発生に応じて被試験装置(4)は順次該当する機能を実施してゆき、付属されている記録装置(図示せず)によつてその実施結果を記録する。被試験装置(4)に加えられた模擬信号の時刻および種類は順次印字装置(6)によつて印字記録され、さらに各時刻において加えられる模擬信号の種類はディスプレイ装置(7)に順次必要な時間間隔だけ表示されてゆくの、被試験装置(4)における処理結果と印字装置(6)による模擬信号の記録とを検査することにより、

(3)

4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示すブロック図である。

図において(1)は記憶装置、(2)は模擬信号発生装置、(4)は被試験装置、(6)は印字装置、(7)はディスプレイ装置である。

代理人 島野信一

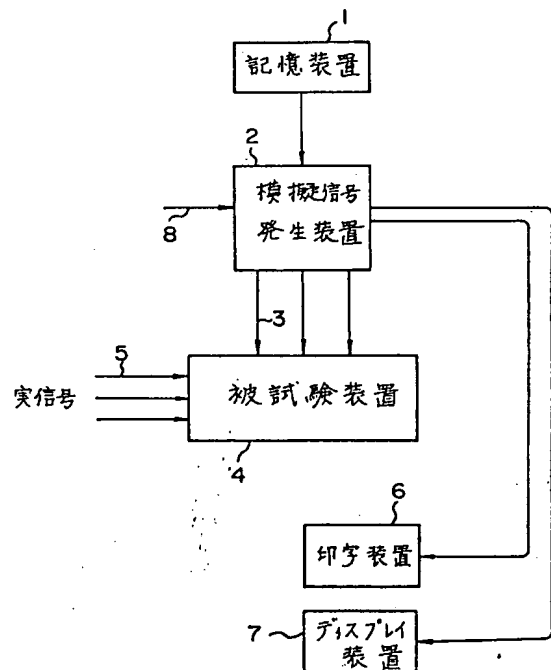
あるいは模擬信号の間隔が比較的長い場合には各模擬信号の発生ごとにディスプレイ装置(7)の表示を見ながら、被試験装置(4)の試験を行うことができる。

この発明の装置はこのような動作をするから、種々の場合を想定した模擬信号を発生させるためのデータを記憶装置(1)に記憶しておけば、短時間のうちに多くの場合について試験を行うことができ、しかも試験のための操作が容易であり、試験の結果不良が発見され、その不良を修復した後に再試験を行う場合などのように、繰り返して試験を行う必要がある場合には特に有用である。

なお上記実施例では印字装置(6)とディスプレイ装置(7)の両方を備えた場合を説明したが、これらのいずれか一方のみを備えたものによつても同様の効果を得ることができる。

以上説明したように、この発明によれば工業用計算機システムなどの試験を短時間に多くの場合を想定して行うことができる。

(4)



(5)